

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2002年12月11日

出願番号 Application Number: 特願2002-359809

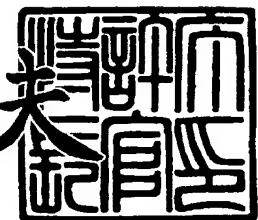
[ST. 10/C]: [JP2002-359809]

出願人 Applicant(s): 富士ゼロックス株式会社

2004年1月9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 FE02-01688

【提出日】 平成14年12月11日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01B 11/24

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい

富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 山口 義紀

【特許出願人】

【識別番号】 000005496

【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

【電話番号】 0462-38-8516

【代理人】

【識別番号】 100086531

【弁理士】

【氏名又は名称】 澤田 俊夫

【電話番号】 03-5541-7577

【選任した代理人】

【識別番号】 100093241

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮田 正昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100101801

【弁理士】

【氏名又は名称】 山田 英治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038818

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【ブルーフの要否】	要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 三次元画像撮像装置および方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 直線偏光成分を有する光を対象物に投射する投光手段と、該投光手段に対し主点を異なる位置に配置した一乃至複数の撮像手段と、該対象物からの反射光のうち一つの偏光面を有する光を透過させる偏光面選択手段とを有し、該一乃至複数の撮像手段は、該対象物からの反射光のうち該偏光面選択手段を透過した光に基づく反射像を撮像し、該反射像に基づいて該対象物の三次元形状を計測することを特徴とする三次元画像撮像装置。

【請求項 2】 該直線偏光の偏光面に対する該偏光面選択手段の偏光面の角度を相対的に変化させる角度調整手段を具備する請求項 1 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 3】 該角度調整手段は該投光手段を回転させる回転機構を含む請求項 1 または 2 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 4】 該角度調整手段は該偏光面選択手段を回転させる回転機構を含む請求項 1, 2 または 3 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 5】 該角度調整手段は 1/2 波長板を回転させる回転機構を含む請求項 1, 2 または 3 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 6】 該直線偏光の偏光面に対する該偏光面選択手段の偏光面の角度は、略垂直である請求項 1 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 7】 該角度調整手段により該対象物からの反射光に含まれる正反射成分を除去した光からなる反射像を撮像する請求項 2, 3, 4 または 5 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 8】 該投光手段は、光源と光整形光学系と偏光変換光学系とから構成される請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6 または 7 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 9】 該投光手段は、光源と光整形光学系と偏光フィルタとから構成される請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6 または 7 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 10】 該偏光面選択手段に偏光フィルタを用いた請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 または 9 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 11】 該直線偏光成分を有する光を用いて符号化された複数のパターン光を投射する請求項 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 または 10 記載の三次元画像撮像装置。

【請求項 12】 直線偏光成分を有する光を投射する投光手段を用いて対象物に投光し、該投光手段と主点を異なる位置に配置された一乃至複数の撮像手段を用いて、該対象物からの反射光のうち一つの偏光面を有する光を透過させる偏光面選択手段を透過した光に基づく反射像を撮像し、該反射像に基づいて対象物の三次元形状を計測することを特徴とする三次元画像撮像方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は一乃至複数のカメラによる三角測量法により輝度情報とともに距離情報を入手する三次元画像撮影装置および方法係り、偏光光学系を用いることにより計測点数を増やしつつ計測精度を向上させるようにしたものである。

【0002】

【従来の技術】

対象物の形状を測定する手法は、パッシブ手法（三角測量法、shape from X）とアクティブ手法（光飛行時間測定法、三角測量法）に大別される。パッシブ手法とアクティブ手法の違いは、対象物に対し何らかなエネルギーを照射するか否かの差である。一般的にアクティブ手法は、計測のあいまいさを除去できるためパッシブ手法に比べてノイズに強い計測手法と言える。

【0003】

両者の手法においてそれぞれ存在する三角測量法は、基線長とその両端から対象物上の計測点を結んだ直線のなす角により、計測点までの距離を求める幾何学的手法である。アクティブ型の三角測量法の中には複数のコード化されたスリットパターン光を照射するマルチパターン投射方式と呼ばれる計測手法が提案されている (Chu-Song Chen, "Range data acquisition using color structured lighting and stereo vision", Image and Vision

n Computing 15, pp. 445-456, 1997)。

【0004】

この方式の構成図を図7に示す。図7において、光の濃淡、色などにてコード化された複数のスリット光を投光系11により対象物12に投射し、2眼のステレオ視により形状計測を一括で行う方式である。対象物12上にて反射された複数のスリット反射像を左右の第1の撮像系13および第2の撮像系14にて撮像し、取得された二つの画像を比較することにより、対象物12上の対応点を決定する。対応点が求まれば先に示した幾何学的手法により、対象物12までの距離が求まる。

【0005】

ここで投射光には図8に示すように様々な偏光面を持った自然光（ランダム偏光）が投射される。この場合、光沢物質など鏡面性が高い対象物では、物体表面が完全拡散反射から大きく逸脱しているので、光の反射空間分布が大きく偏り、同一のスリット光による反射像にもかかわらず、左右の撮像系にて取得される反射像の濃淡は大きく異なる結果となる。例えば撮像系の位置が視点A, B, Cによって反射光には大きな光成分を持った正反射成分と拡散成分の両方を含む視点A（正反射方向）と拡散成分しか含まない視点B, Cが存在する。従って左右の撮像系にて取得されるスリット画像を比較し、その濃淡にて対象物上の対応点を決定するこの方式では、誤対応が大量に発生あるいは対応点が見つからないという問題が発生する。

【0006】

図9は偏光フィルタを用いることにより上記正反射成分を取り除こうとした装置の構成図である。しかしながらこの構成においても、正反射方向である視点Aにおける反射光には、ランダム偏光である投射光のランダム性が維持されているので、偏光フィルタをどのように回転調整しても正反射成分は除去できない。よって上述した問題は解決できないのが現状である。

【0007】

また撮像系Bと撮像系Cでは、取得される反射像は略等しくなり、このようなレイアウトにて二つの撮像系を設置すれば誤対応は減少するケースは存在する。

しかしながら、このような構成であると撮像系のレイアウトに制約がある、複数の傾きを持つ対象物の場合には適応不可能である、正反射成分の空間分布の広がりが図8、図9にて示した比較的狭い場合（鏡面性が高い光沢物）からブロードな広がり（鏡面性が低い光沢物）に移行した場合に撮像系Bにおいても正反射成分の一部が撮像されることによる誤対応の発生により適応できるケースは非常に狭く、現実的な構成ではない。

【0008】

以上の例では撮像系は2つの場合を例に説明したが、投光系が一つに対し撮像系が一つの構成においても同様な問題が発生する。すなわち撮像系の視点や対象物面の傾きによりパターン反射像の濃淡が変化し、投射光と撮像された反射像との対応がつかなくなり、誤対応が大量に発生あるいは対応点が見つからないという問題が発生する。

【0009】

なお、本発明と関連する先行技術としては、光切断線を用いて被測定物の三次元形状を測定する際に、被測定物とカメラとの間に偏光フィルタを設けて不要な光が入り込まないようにする手法がある（例えば特許文献1）。

【特許文献1】

特開2002-162208公報

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明は、光沢のある対象物においても距離画像の計測点数を増やしつつ計測精度を向上させる三次元画像撮像手法を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

本発明の一側面によれば、上述の目的を達成するために、三次元画像撮像装置に：直線偏光成分を有する光を対象物に投射する投光手段と；該投光手段に対し主点を異なる位置に配置した一乃至複数の撮像手段と；該対象物からの反射光のうち一つの偏光面を有する光を透過させる偏光面選択手段とを設けている。

【0012】

該一乃至複数の撮像手段は、該対象物からの反射光のうち該偏光面選択手段を透過した光に基づく反射像を撮像し、該反射像に基づいて該対象物の三次元形状を計測する。

【0013】

この構成においては、対象物に投射する光を直線偏光にすることにより、反射像の濃淡が、対象物の表面の正反射方向や撮像手段の位置により変動するのを抑えることができる。

【0014】

また、この構成において、該直線偏光の偏光面に対する該偏光面選択手段の偏光面の角度を相対的に変化させる角度調整手段を設けてもよい。該角度調整手段は、例えば、該投光手段を回転させる回転機構や、該投光手段に設けられた1／2波長板を回転させる回転機構を含んでも良いし、該偏光面選択手段を回転させる回転機構を含んでも良いし、双方を含んでも良い。

【0015】

該直線偏光の偏光面に対する該偏光面選択手段の偏光面の角度は、例えば、略垂直である。

【0016】

該角度調整手段により該対象物からの反射光に含まれる正反射成分を除去した光からなる反射像を撮像することが好ましい。

【0017】

該投光手段は、例えば、光源と光整形光学系と偏光変換光学系とから構成されてもよいし、また、光源と光整形光学系と偏光フィルタとから構成されてもよい。

【0018】

該偏光面選択手段は例えば偏光フィルタである。

【0019】

該直線偏光成分を有する光を用いて符号化された複数のパターン光を投射するようにしてもよい。

【0020】

なお、本発明は、装置またはシステムの発明として実現できるのみでなく、方法の態様でも実現可能である。

【0021】

本発明の上述の側面および本発明の他の側面は特許請求の範囲に記載され、以下実施例を用いて詳細に説明される。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の実施例を具体的に説明する。

【0023】

図1に本発明の第1の実施例の構成図を示す。図1において、本実施例における三次元画像撮影装置は、直線偏光成分を有する光を投射する直線偏光投光系21と、二つの撮像系（第1の撮像系22、第2の撮像系23）および一つの偏光面を持った光のみを透過させる偏光面選択手段としての二つの偏光フィルタ24、25と、パーソナルコンピュータ（図示しない）とを有して構成される。パーソナルコンピュータは、投光系21と第1の撮像系22、第2の撮像系23とを制御し、かつ得られた三次元画像を表示するための装置である。偏光フィルタ24、25は二つの撮像系22、23の前にそれぞれ配置した。26は三次元撮像の対象物である。

【0024】

直線偏光投光系21には、ハロゲンランプやキセノンランプ等とランプビームを集光させる役目をするリフレクタから構成される光源と、液晶プロジェクタにおいて一般に使用されているコンデンサレンズと光インテグレータ等から構成される光整形光学系と、PBS（Polarized Beam Splitter）プリズムと1/2波長板等から構成される偏光変換光学系とを用いた。この偏光変換光学系により光源から射出される自然光（ランダム偏光）を单一の偏光面を持った直線偏光（单一偏光）に高効率に変換した。この変換は例えば図2に示すように行われる。偏光変換光学系におけるランダム偏光から单一偏光への光利用率は90%程度と高く優れた変換方式と言える。この直線偏光投光系を用いて直線偏光成分を有する光を形成し、光の濃淡や色等を用いて符号化された複数

のパターン光を対象物に投射した。符号化された複数のパターン光は、液晶パネル等によるライトバルブを用いて形成してもよいし、透過率や色の違う複数のスリットが形成されたフィルムやガラス板を用いててもよい。また、図2に示した偏光変換光学系の先に1／2波長板（図示しない）をさらに設けておいても良い。

【0025】

次に図3にて本実施例により計測エラーが減少するメカニズムを説明する。直線偏光投光系21を用いて直線偏光成分を有する光を形成し、符号化された複数のスリット光を対象物に投射する（投射光：単一偏光）。ここで対象物の表面状態により、物体表面からの反射光の反射状態は大きく異なる。紙や石膏、陶器等の物体ではその表面が完全拡散反射面に近いため反射光は拡散反射成分が支配的である。一方光沢がある塗装、プラスチック、OA製品に良く用いられている梨地塗装、表面塗装された木製部材、ヘアーラインや梨地等の表面加工された金属表面、フラットな金属表面では、反射光成分には拡散反射成分に加え正反射成分が含まれ、結果として光の反射空間分布が偏る。各部材表面の光沢度が大きくなるのに従い、正反射成分の反射光に占める割合は増加し、光の反射空間分布の偏りも大きくなる。この現象は投射光の入射方向に対する正反射方向を中心にして現われる。正反射方向においては正反射光と拡散反射光が観察され、光沢度が大きくなるの伴い、正反射光の強度は増加し、拡散反射光は減少する。またこの正反射方向における正反射光は投射光の直線偏光状態が維持され（単一偏光）、拡散反射光は偏光面が一定ではないランダムな偏光となる。

【0026】

撮像系Aの視点を正反射方向に設置し反射像を撮像した。この撮像系Aの撮像面の手前に偏光フィルタを設置し、偏光フィルタの偏光面を正反射光の偏光面と略垂直になるように偏光フィルタを回転調整した。偏光フィルタの回転角度は固定で、直線偏光投光系を投光中心にて回転して調整しても構わない。撮像系Aでは、偏光フィルタにより正反射光はカットされ、拡散反射光の中で偏光フィルタと同一の偏光面を持った光からなる反射像だけが撮像される。偏光フィルタの回転角度は固定で、直線偏光投光系全体を投光中心にて回転させて調整してもかまわないし、偏光変換光学系の先に設けた1／2波長板単体を回転させて調整して

もかまわない。

【0027】

撮像系B, Cの手前にも偏光フィルタを設置し、撮像系Aの場合と同様に偏光フィルタの偏光面と正反射光の偏光面とが略垂直の関係になるように調整した。撮像系B, Cにおいても拡散反射光の中で偏光フィルタと同一の偏光面を持った光からなる反射像だけが撮像される。比較的低光沢な対象物の場合、正反射光の空間分布は広がるため撮像系Bの視点Bの方向においても正反射光の一部が反射されるが、撮像系Aの場合と同様な理由により拡散反射光の中で偏光フィルタと同一の偏光面を持った光からなる反射像だけが撮像される。

【0028】

このようにして取得されたスリット反射像は、視点A, B, Cにおいて同一のスリット光による反射像にもかかわらず、反射像の濃淡あるいは色が大きく異なる従来の装置とは違い、同一の明るさあるいは色を持ったスリット画像が取得される。従って左右の撮像系にて取得されるスリット画像を比較し、その濃淡あるいは色にて対象物上の対応点を決定する際に、精度良く対応点を決定できる。

【0029】

図4は本発明の第2の実施例である。直線偏光投光系31は光源（図示しない）と光整形光学系（図示しない）と偏光フィルタ32とから構成される。光源から投射される光は偏光面が一定でない自然光（ランダム偏光）であるが、偏光フィルタ32にて単一の偏光面のみを透過させることにより、直線偏光投光系31を構成した。この実施例の特徴として、第1の実施例に比べ直線偏光投光系31を小型、安価に作製でき、また偏光面の回転調整を投光系手前に設置した偏光フィルタ32にて簡単に行える点が挙げられ、小型、軽量、安価なシステムに適した構成と言える。光整形光学系を省いてもよく、この場合、更なる小型、軽量、安価なシステムが作製できる。

【0030】

第1の実施例および第2の実施例は、二つの撮像系にて構成されているが、一つの撮像系にて構成されても構わない。この場合、投射光と撮像された反射像との対応を取ればよい。

【0031】

第1の実施例および第2の実施例において、直線偏光成分を有する光には、単一の偏光面を持った光の例を示したが、これは複数あっても構わない。第1の実施例における偏光変換光学系では、ランダム偏光をP偏光とS偏光に分けた後、1/2波長板を用いてS偏光をP偏光に変換している。装置のコストや大きさの制約から1/2波長板を省いて偏光面が直行するP, S偏光をそのまま投射しても構わない。その場合、正反射光の偏光面と偏光フィルタの偏光面の角度調整は、P, S偏光に対応した正反射光の偏光面と同一にならないように調整する。

【0032】

また第1の実施例および第2の実施例において、濃淡や色等により符号化した投射パターンには、横方向に並んだ複数のスリットから構成したが、本発明ではこれに留まらず縦方向にも濃淡や色等により分割した符号化したパターンを用いてもよい。

【0033】

本発明では、形状計測とともに対象物の輝度情報も取得可能である。符号化パターンから白色光に切り替えた状態で対象物に光を投射し、あるいは投光系を使用せず外部の照明装置により、最適な照明光を照射することにより対象物の質感を高めた状態で、本実施例で示した装置により対象物の輝度情報を取得する。これにより、距離情報のみならず輝度情報も取得が可能になり、対象物の形状データに輝度データを貼り付けて表示する3Dコンテンツ制作の際のデータ提供も可能になる。

【0034】

図5は本発明の第1の実施例の効果を従来の三次元画像撮像装置と比較して示した図である。横軸に鏡面光沢度、縦軸に算出率を示してある。ここで鏡面光沢度は正反射方向の反射光束が光沢度に比例するものとして定義され、標準面の反射光束との比で表される。標準面（屈折率1.567のガラス）の光沢度 G_{os} を100とし、標準面の反射光束 ϕ_{os} 、試料の反射光束 ϕ_s とした場合、鏡面光沢度 G_s は、 $G_s = (G_{os}/\phi_{os}) \cdot \phi_s$ として現される。

【0035】

各種素材の表面の鏡面光沢度の例を図6に示す。

【0036】

計測装置としては（株）堀場製作所のgloss checker IG-330を用いた。

【0037】

算出率は撮像系にて撮像した計測対象箇所の全画素数に対して、計測された距離画素数の比率とした。石膏や紙等の鏡面光沢度が10以下の拡散反射が支配的な反射面では、両装置ともに高い算出率が得られているが、従来の三次元画像撮像装置では鏡面光沢度が上昇するに従い算出率が急激に低下し、鏡面光沢度60前後でほぼ0%となり形状を計測することができない。算出率は鏡面光沢度60以降において多少回復し再び下降する。これに対し本発明の三次元画像撮像装置では鏡面光沢度100程度まで全域に渡り80%以上の高い算出率を達成している。これは鏡面光沢度100程度までは本発明の偏光光学系により、光沢面にて反射された正反射成分を除去でき、正反射領域を抑制できたことによるものである。算出率は鏡面光沢度100以降からなだらかに下降する。これは拡散反射成分が減少することにより、撮像系にて取得される反射像のコントラストが極端に低下することによる。取得されたスリット画像のコントラストが低下するとスリット間の濃淡あるいは色の差が少なくなり、対応点のマッチング精度が低下し、形状データが算出できなくなる。また従来の三次元画像撮像装置において鏡面光沢度60付近から算出率が一時的に上昇するのは、光沢物の鏡面性が増加することにより、正反射領域が縮小されることによる。

【0038】

鏡面光沢度が0から100の間には、図5に示した石膏、紙等の低光沢物から各種工業部品に使用されている金属梨地加工品、プロジェクタやノートPC、携帯電話等の表面塗装に使用されている梨地塗装品、玩具や各種工業部品等に使用されているマット塗装品、表面塗装された木製部材、プラスチック部材、各種工業部品等に使用されている金属ヘアーライン加工品等がある。本発明の実施例によれば、これら対象物の形状データを良好に取得でき、しかも形状データに加え輝度データも取得できるので、3Dコンテンツ制作の際、コンテンツ対象が大幅

に広がる。その結果、従来では3DCGにより長時間かかった作製時間を大幅に短縮できる大きなメリットがある。

【0039】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、偏光光学系を用いることにより光沢のある対象物においても計測点数が増え、かつ計測精度が向上した距離画像を一括にて取得でき、例えば、3Dコンテンツの作製時間を大幅に短縮できる三次元画像撮像手法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例における三次元画像撮像装置の構成図である。

【図2】 上述の実施例で用いる偏光変換光学系の例を説明する図である。

【図3】 本実施例により計測エラーが減少するメカニズムを説明する図である。

【図4】 本発明の第2の実施例における三次元画像撮像装置の構成図である。

【図5】 本発明の効果を従来の三次元画像撮像装置と比較して示した図である。

【図6】 各種材料の表面の鏡面光沢度の例を示す図である。

【図7】 従来の三次元画像撮像装置の構成図である。

【図8】 従来の三次元画像撮像装置の計測エラーが発生するメカニズムを説明する図である。

【図9】 従来の別の三次元画像撮像装置の構成図である。

【符号の説明】

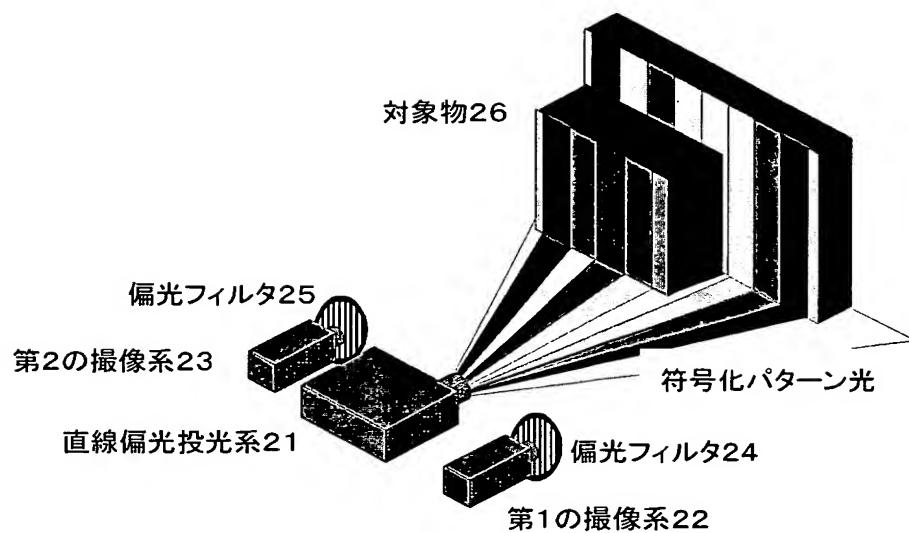
- 1 1 投光系
- 1 2 対象物
- 1 3 第1の撮像系
- 1 4 第2の撮像系
- 2 1 直線偏光投光系

- 2 2 第1の撮像系
- 2 3 第2の撮像系
- 2 4 , 2 5 偏光フィルタ
- 2 6 対象物
- 3 1 直線偏光投光系
- 3 2 偏光フィルタ

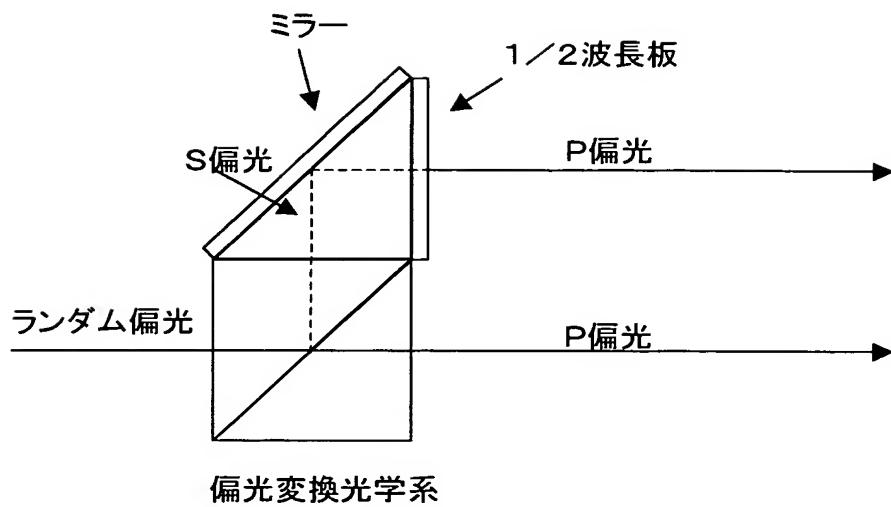
△

【書類名】 図面

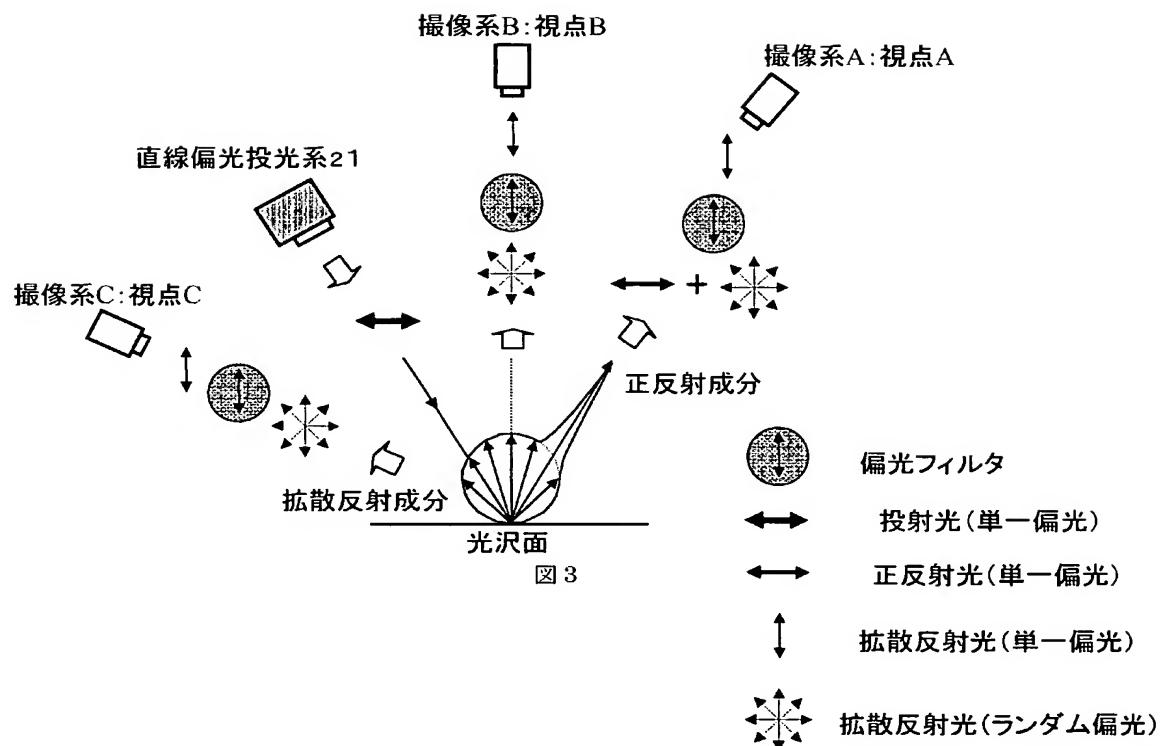
【図1】



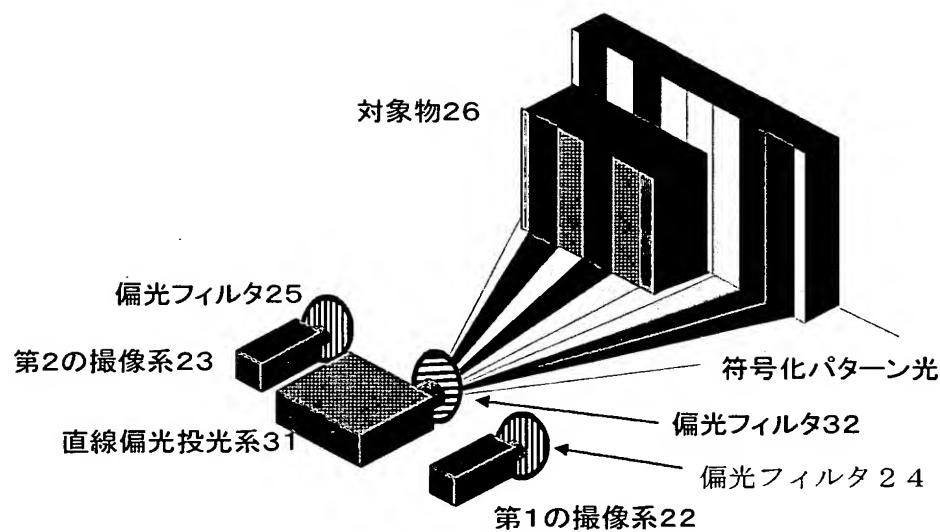
【図2】



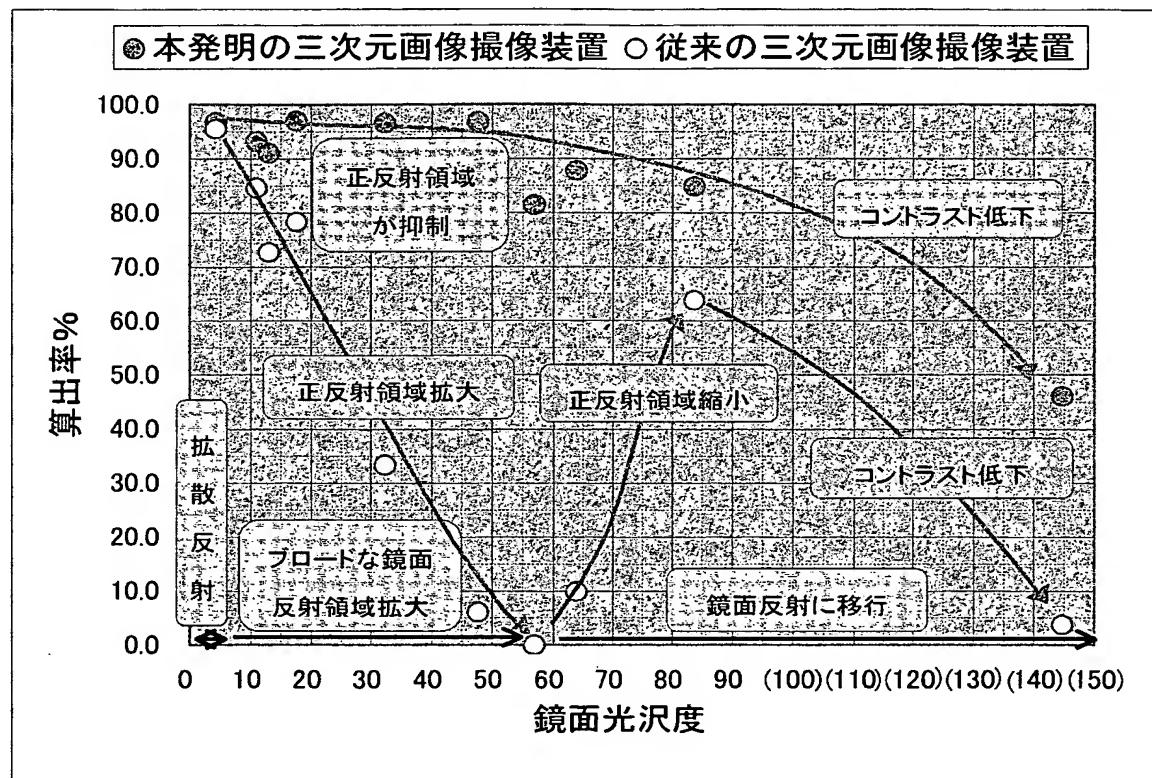
【図3】



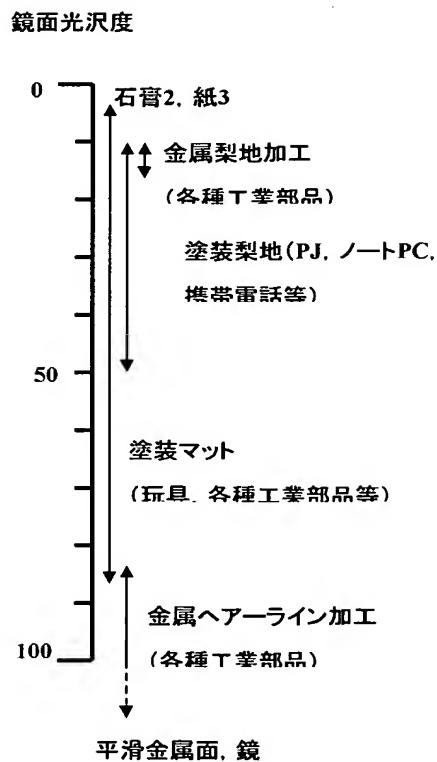
【図4】



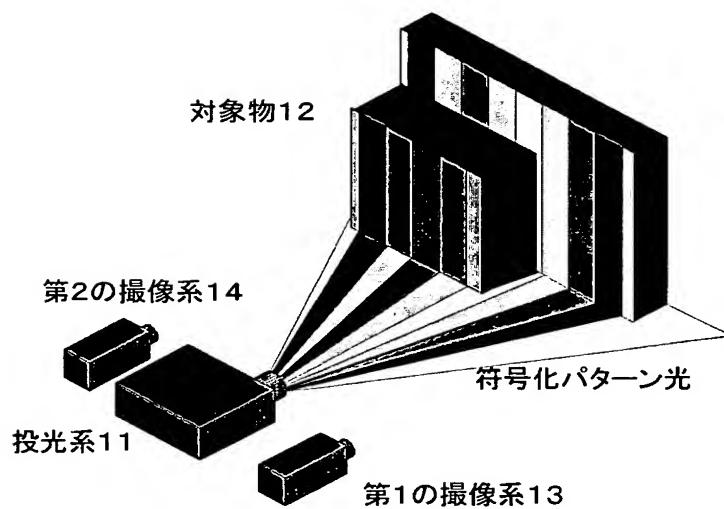
【図5】



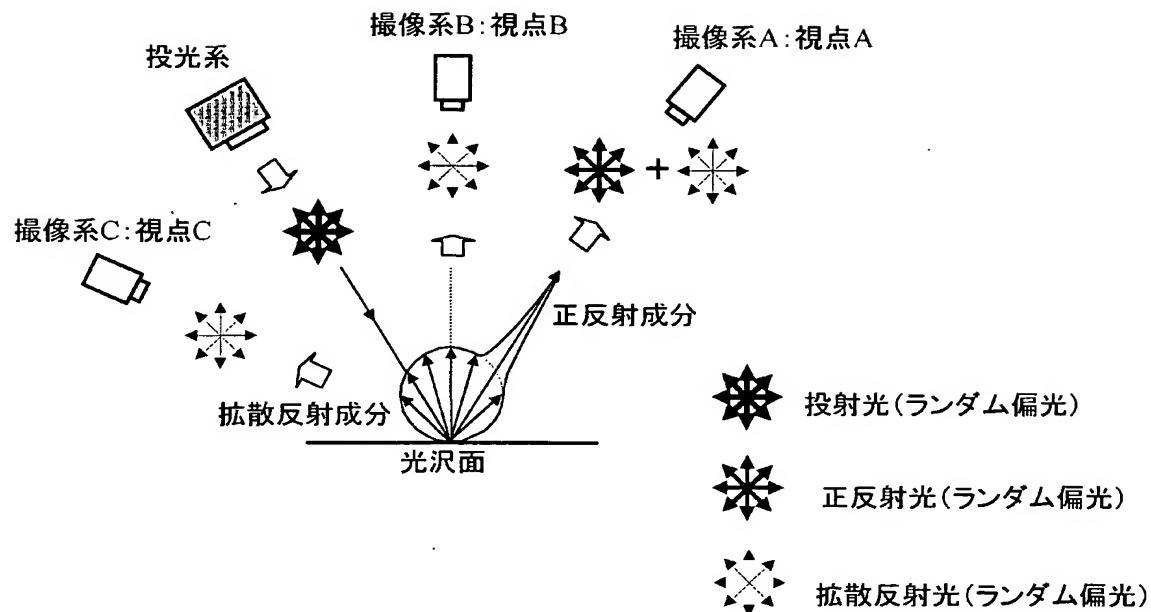
【図6】



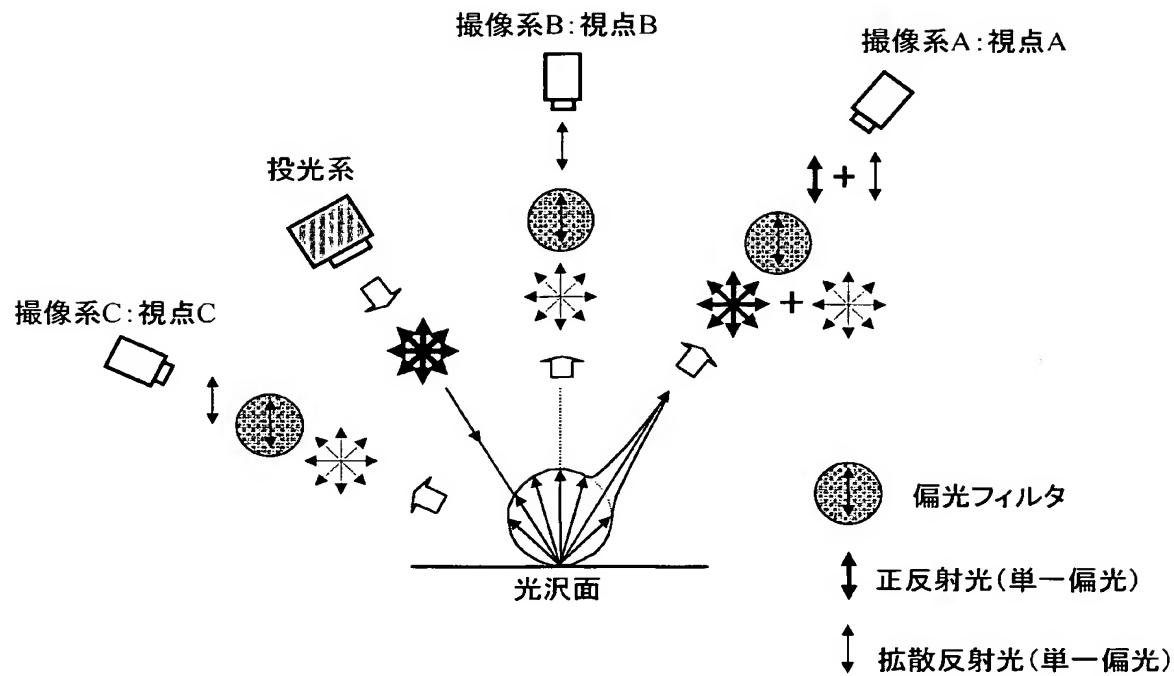
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光沢のある対象物においても計測点数を増やしつつ計測精度を向上させる。

【解決手段】 直線偏光投光系21により直線偏光成分を有する光を対象物22に投射し、対象物26からの正反射光を除去する偏光フィルタ24、25を用い、正反射光を除いた反射像を視点の違う一乃至複数の撮像系22、23にて撮像する。撮像した反射像に基づいて三角測量により対象物の三次元形状を測定する。光沢のある対象物においても計測点数が増え、かつ計測精度が向上した距離画像を一括にて取得できる。

【選択図】 図1

特願2002-359809

出願人履歴情報

識別番号 [000005496]

1. 変更年月日 1996年 5月29日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区赤坂二丁目17番22号
氏 名 富士ゼロックス株式会社